Test Probe

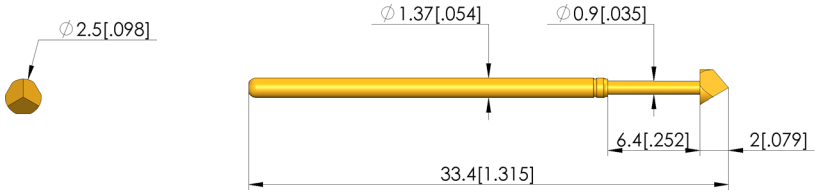
GKS-100 307 250 A 1000

Article GKS-100-1192

Partner for Future Technology

- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact





Données générales

Temperaturbereich:	-40 – 80 °C
Groupe de produits:	Course standard GKS, ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Course standard GKS
Série:	GKS-100
Trame:	3 mm
Mise en contact de:	Pad, Via
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-100
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	33,4 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,37 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	0,35 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage
Diamètre de tête:	2,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

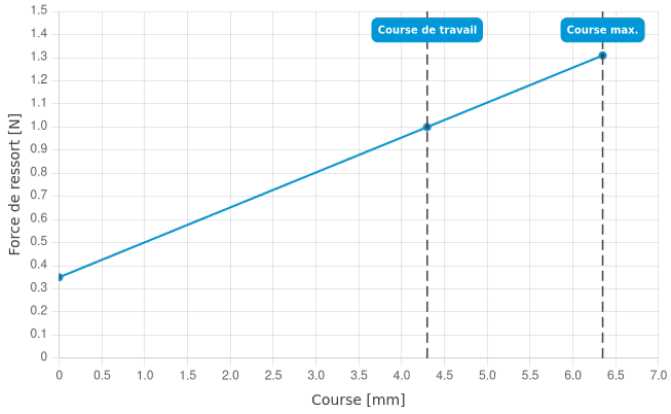
POINTES DE TEST ICT/FCT

Test Probe

GKS-100 307 250 A 1000

Article GKS-100-1192

Partner for Future Technology



POINTES DE TEST ICT/FCT